

S F G計測システム 利用規定

(1) 本装置の特長

本分光システムは、ピコ秒 Nd-YAG レーザ、波長変換装置、赤外ビーム発生装置および和周波シグナル計測部から構成されています。可視光（波長一定）と波長可変の赤外光を試料に照射して、2次の非線形光学効果によって発生した和周波光を検出し、表面・界面の吸着分子（あるいは官能基）の状態を選択的に測定することができます。

赤外レーザーの波長範囲：2.3 ~ 10 μm

特徴：

- ・バルク中に吸着分子が存在しても、表面・界面の情報のみが得られる。
- ・サブモノレイヤーの感度 分子種の表面・界面濃度解析
- ・吸着（修飾）分子の配向、配置（絶対方位）の解析
- ・気固・気液界面測定：容易 液々・固液界面測定：工夫が必要

(2) 利用方法、手続方法：

利用者は所定の講習を受けた方に限ります。（講習は随時受けつけます。）

利用に際しては担当者に連絡して予約を取ってください。

特殊な測定に関しては、運営責任者に相談下さい。

(3) 利用料金：

1,000円/1時間（YAG Laser のフラッシュランプ交換代から計算していません。）

(4) トラブルが生じた場合は、直に運営責任者に相談してください。

(5) 特記事項：レーザーを使用しているため、安全のため

- ・測定準備や光学調整は原則1名で行う
- ・腕時計，指輪，ネックレス，ピアス等の光を反射するものは身体から外す